

СОДЕРЖАНИЕ

Новые компоненты для электронной аппаратуры	
Индуктивность, перестраиваемая электрическим полем. Семёнов А. А., Усанов Д. А.	3
Электронные средства: исследования, разработки	
Гибридный автодинный сенсор магнитного резонанса. Браиловский В. В., Верига А. Д., Политанский Л. Ф.	7
Установка для измерения удельного коэффициента силы света материалов со световозвращающим эффектом. Бутенко В. К., Добровольский Ю. Г., Шабашкевич Б. Г., Юрьев В. Г.	10
Системы передачи и обработки сигналов	
Оптимизация процесса поиска неизвестного количества движущихся объектов. Гришин И. Ю.	13
Сенсоэлектроника	
Оптимизация конструкции мембранных датчиков. Рубцевич И. И., Высоцкий В. Б., Ковальчук Н. С.	16
Функциональная микро- и нанoeлектроника	
Разработка схемы и топологии элементов матрицы управляемых автоэмиссионных кремниевых микрокатодов. Дружинин А. А., Голота В. И., Козут И. Т., Ховерко Ю. Н.	20
Вольт-фарадные измерения в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs. Горев Н. Б., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н.	25
Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS. Бобренко Ю. Н., Ярошенко Н. В., Шереметова Г. И., Семикина Т. В., Атнаев Б. С.	29
Измерения ВАХ импульсных кремниевых ЛПД на участке лавинного пробоя. Кудрик Я. Я.	32
Обеспечение тепловых режимов	
Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме Q_{0max} . Зайков В. П., Киншова Л. А., Казанжи Л. Д., Храмова Л. Ф.	34
Технологические процессы и оборудование	
Корреляция параметров арсенид-галлиевых эпитаксиальных слоев и технологии их выращивания. Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н.	38
Исследование погрешности сопротивления тонкопленочного резистора. Спирин В. Г.	42
Формирование мезаструктур 4H-SiC $p-i-n$ -диодов методом ионно-плазменного травления. Болтовец Н. С., Борисенко А. Г., Иванов В. Н., Федорович А. О., Кривуца В. А., Полозов Б. П.	45
Материалы электроники	
Наноструктурированная композитная пленка для сенсоров влажности. Коваленко К. Л., Шаран Н. Н., Севистьянов В. В.	49
Способ определения доли кристаллов в стеклокерамическом диэлектрике. Дмитриев М. В., Еримичой И. Н., Панов Л. И.	50
Метрология. Стандартизация	
Малогабаритные цифровые частотомеры сверхвысокочастотного диапазона. Криваль И. И., Скрипнюк А. И., Проценко В. А., Марьенко А. В.	54
Библиография	
Анотации к статьям номера	58
Новые книги	12, 15, 19, 28, 31, 48, 53, 57
В портфеле редакции	15
Выставки. Конференции	2-я, 4-я стр. обл.